科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 26 年 6月17日現在

機関番号: 82108 研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2011~2013

課題番号: 23654125

研究課題名(和文) E u O における電界効果誘起磁気ポーラロンの研究

研究課題名(英文)Study on mangetic polaron induced by electric field effect in EuO

研究代表者

鈴木 博之(Suzuki, Hiroyuki)

独立行政法人物質・材料研究機構・量子ビームユニット・主幹研究員

研究者番号:60354370

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,800,000円、(間接経費) 840,000円

研究成果の概要(和文):希土類酸化物EuOは強磁性転移と更に絶縁体 金属転移を起こす稀な物質で、転移メカニズムにはキャリアで誘起される磁気ポーラロンが原因ともされている。固体表面にキャリアを導入できる電界効果、つまり電界効果ドーピングによって磁気ポーラロンやそれによる転移を制御することができれば、スピントロニクスデバイスとして新しい原理を導入できる可能性がある。本研究ではEuOの純良な単結晶育成を行うところから始め、得られた単結晶の劈開面を利用して、電界効果によるキャリア増幅効果に初めて成功した。

研究成果の概要(英文): Rare earth mono-oxide EuO is one of rare substances, which shows both ferromagnetic and insulator-metal transitions. Magnetic polaron induced by a carrier is considered to play an important role in the mechanism of the transitions. When the magnetic polaron and also the resulting transitions can be controlled by the electric field effect introducing the carrier into the bulk surface state, i.e. electrostatic carrier doping (ESD), it will be a candidate of new operation principal in the spintronics devices. In this research, we have performed high quality single crystal growth of EuO and have first succeeded in ESD by field effect transistor fabricated on the cleaved surface of the obtained single crystal.

研究分野: 数物系科学

科研費の分科・細目:物理学・物性日

キーワード: 電界効果 磁気ポーラロン 金属絶縁体転移 強磁性転移 希土類酸化物 純良単結晶育成

a1.研究開始当初の背景

希土類酸化物 EuO は、約 70K で高温の常磁 性状態から強磁性へ転移し、直後に絶縁体-金属転移を示す非常に稀な物質である。また、 この EuO では、僅かなストイキオメトリから のずれによる酸素欠陥、または Eu²+サイトへ の Gd³⁺や La³⁺の 3 価の置換元素は、ドナーと なって電子を供給するが、この電子はその欠 陥や置換元素に束縛され、周囲の Eu²⁺の磁気 モーメントの間の磁気相互作用によって磁 気ポーラロンが形成される。EuO における、 絶縁体では稀な強磁性転移の原因としては、 この磁気ポーラロンの可能性も示唆されて いる。Eu0 の研究は 1960 年代から始まってい るが、この磁気ポーラロンの存在を示唆する 実験結果が赤外光や µSR の実験で得られた のは最近で、磁気ポーラロンと強磁性転移と の関係は、未だ解明に至っているわけではな

一方、絶縁体-金属転移については、主に 光学遷移の実験による結果から、強磁性転移 における伝導バンドの分裂や、欠陥酸素にト ラップされた電子状態準位の分裂によって、 ドナー電子が伝導帯に流れ込むことが提案 されている。しかしながら、この絶縁体-金 属転移は強磁性転移と同時に起こるわけで なく、ややずれた低温で発現していおり、Tc 以下の帯磁率の減少に伴い磁気ポーラロン が拡がり、磁気ポーラロン同士の重なり、そ れによってバンド状態を形成することも提 案されおり、こちらも未だ解決されていない 問題と言える。

同じ希土類磁性半導体である SmS では、圧 力誘起で絶縁体から金属へ転移を起こすこ とで注目を浴び、同じように 40 年前以上か ら盛んに研究が行われた。特に、絶縁体相か ら金属相へ転移を起こす中間相として golden phase と呼ばれる金色を示す相があり、 抵抗では半導体的な振る舞いが見られるも のの、比熱では大きな電子比熱係数を示す異 常が報告されるなど、本質的な理解はされて いなかった。最近になり再び系統的試料作製 が行われ、試料依存性を明らかにした上で、 圧力下の精確な測定によって、エキシトンの 束縛状態が重要な役割を示すことがわかっ てきた。そこにはボーズ粒子の性質に伴う、 興味深い物理が展開すると考えられ、改めて 注目されてきている。

基本的な電子構造が同じである EuO でも同様なことが期待されるが、全く状況を異対するのは、基本的には非磁性である SmS に対対であるには一メントを有する系である。従って、SmS とは別な状況開発である。従って、SmS とは別な状況開発がある。がある。また、結晶中を動き回標性がる。また、結晶中を動き回標はでは、研究が始まった当初にに提唱されているものの現在までに観測された例はない。実際に、そのような磁気やらに提明はない。実際に、そのような磁気がらによりはない。実際に、そのような磁気があるとして、EuO における強磁性・絶縁体 金属転移のメカニズムに磁

気ポーラロンが関与しているかもわかっていない。新しいタイプの磁気ポーラロンの発見、もしくは、EuO における絶縁体 - 金属転移のメカニズム解明は、キャリアーコントロールによる物性制御に新しい可能性を示すことが考えられ、スピントロニクスにおいても、磁気ポーラロンを利用した新しい原理を提唱できる可能性を秘めている。

2.研究の目的

本研究は、磁気ポーラロンが強磁性転移と 絶縁体-金属転移の鍵を握るとされている Eu0 において、電界効果によってキャリアを 注入し磁気ポーラロンをコントロールする ことにより、磁気ポーラロンと強磁性及び絶 縁体-金属転移の関係を明らかにし、それら の転移のメカニズム解明を目的とした研究 である。

3.研究の方法

上記の研究目的に向けて、本研究では EuO の純良単結晶育成からスタートし、得られた単結晶のキャラクタリゼーションを行い、その劈開面を利用して FET 構造を作成し、電界効果を検証する。

(1) 単結晶育成とキャラクタリゼーション

EuO の融点は 1965 と報告されている。また、Eu と酸素の組成のずれによる物性に与える試料依存性は大きい。従って、物性における本質を見極めるためには、試料作製中における酸素濃度条件を系統的に変化させていく必要がある。本研究では、Eu と Eu₂O₃を出発原料として、タングステン坩堝に高真空中で封入したあと、高周波炉を用いて 2000 近くまで昇温しブリッジマン法により単結晶育成を行う。出発原料の Eu と Eu₂O₃の組成比をパラメータとして系統的に条件を変えていく。

キャラクタリゼーションとしては、磁化率、 抵抗とホール係数の測定によって、試料中の 酸素欠陥量、もしくはドナー濃度等を評価す る。

(2)FET 構造の作成

FET 構造の作製に関しては、薄膜金属における伝導や強相関物質への電界効果の研究を行っている連携研究者の矢ヶ部氏と協力している。電界効果を与えるためには、絶縁破壊を起さないより良質な絶縁層の生成が重要となる。また、FET 加工においては、加工する試料の表面状態が非常に重要になるが、EuO の単結晶は NaCI 構造をとり、図1からわかるように比較的綺麗な劈開面が得られる。この劈開性を利用し、EuO の劈開面((001)面)にFET 構造を作成する。

本研究を始動する当初は、絶縁層としては AI₂O₃から出発し、ユーロピウム自体の酸化膜 Eu₂O₃を利用することも考慮し、EuO に最も適した絶縁層の条件等について最適化を行っ

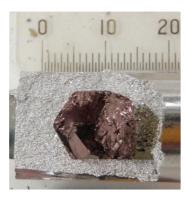


図 1 作成した EuO の単結晶 (紫色の部分)。坩堝の底側が写真の左側となる。右側の真鍮の色の部分が析出したユーロピウム。

ていく予定であった。上記したように連携研究者である矢ヶ部氏と、有効な絶縁層の素材について議論を進め、今回の単結晶の劈開面をそのまま利用する EuO に対しては、熱的なダメージを極力抑えるために、また劈開面をそのまま利用する際に凸凹が表面に残った場合でも利用できるイオン液体 (DEME-TFSI)を使用することになった。

4. 研究成果

(1)単結晶育成とキャラクタリゼーション

単結晶育成では、Eu₃O₄や Eu₂O₃等の酸化物 の発生を防ぐことと、相図において Eu0 相が ストイキオメトリーから酸素過剰の方に幅 を持っていることから、Euをself-fluxとし、 原料の仕込比で約 5%から 15%の間の Eu-rich の組成で条件を振った単結晶育成を行った。 このため、坩堝の中では上部に過剰に仕込ん だ Eu が析出している(図1)。また、得られた 単結晶部分においても結晶育成が始まった 坩堝の底側から上部側に向けて、Eu の過剰 (酸素の空孔)の割合が違い物性に違いが見 られる。代表的な例として磁気ポーラロンを 引き起こすドナー供給をする酸素欠陥があ るとされている、Euを7%過剰に仕込んだ場 合の坩堝の底に近い下側の部分から切り出 した試料について、磁化率と抵抗の温度依存

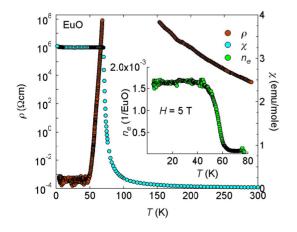


図2 Eu0の磁化率と抵抗の温度依存性。挿入図はホール係数から見積もられた Eu0 当たりの電子数の 80K 以下の温度依存性。

性と、約80K以下のホール係数から見積もられたEu0当たりの電子数の温度依存性を図2に示す。磁化率の温度依存性から得られたCurie点は69.5Kで、この温度から低温に向かい絶縁体から金属への転移へ伴う急減な伝導率の上昇(=抵抗の減少)が観測され、

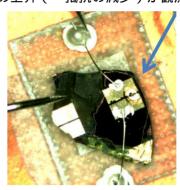


図3 Eu0 の(100)劈開面を用いた試験例。水色矢印の先の金蒸着した電極の部分にイオン液体を垂らしている。左側から延びている金属電極がゲート電極となり、測定時にはイオン液体の上部に位置する。

図には示していないが、比熱にもシャープなピークを観測している。これらはこれまでの報告と一致しているが、熱膨張係数において50K付近に異常が観測されており、その原因については未だ解明できていない。金属相での電子密度も文献値とほぼ同じで、絶縁体から金属への転移において、約2桁程度のキャリアの増加している。

(2)FET 構造作成と電界効果

作成した単結晶においては、大きい場合は ~1cm² 程度の(100)面の劈開面が得られる場 合もあり、本課題の目的である電界効果のた めの FET 構造の作成には十分な条件を持って いる。FET 構造を作成する試料表面としては、 劈開面をそのまま使う場合や、更に研磨する 場合、また電極についても金蒸着や針電極等 様々な方法で試行した。図3は電極に金蒸着 を用いた試験例である。これらの試行の中で、 劈開面を利用した簡易的な針電極を用いた プローフを用いた方法で、電界効果による p 型の増幅効果を観測することに成功した。図 4 にゲート電圧が負の場合の I-V 特性の図を 示す。|Vg|が増加するのに対し、ドレイン電 流 Isd が増加しており、正のキャリアが誘起 されていることがわかる。一方、正のゲート 電圧の場合ではドレイン電流が減少し正の キャリア抑制されており、負のゲート電圧の 場合とコンシステントな結果である。この場 合の実験では、金蒸着ではなく針電極を用い たので、イオン液体からの漏電を起こす可能 性が高く、イオン液体の部分とドレイン・ソ ス電極を十分に引き離すことが必要とな った。このため、印加した電界に対する増幅 効果の効率は 30%程度にとどまっている。ま た、今回の結果では EuO 劈開面への FET 構造 を作製したデバイスが p 型の伝導を示すこと になったが、一方では、4-(1)で今回の試料

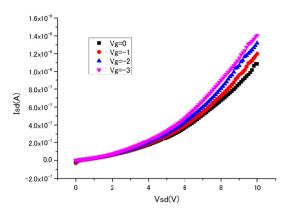


図 4 ゲート電圧が負の時の I-V 特性図。 |Vg|の増加に伴いドレイン電流は増加している。

でも見られるように、EuO は酸素欠陥や Gd ドープなどにより n 型の伝導となる。今回の試料表面は劈開において作製したものの、かなり凸凹がおおきく、電極表面上の絶縁膜が一部破れている可能性も考えられる。そのた響している可能性は否定できない。しかした薄により作製したがエークカレントがエー V 特性に影がしている可能性は否定できない。しかした薄により作製したがら p 型への遷移を光電子分光法により示している結果も報告されており、今回の結果している結果も報告されており、今回の発現している可能性がある。今後表面状態との関連を明らかにしていくことが必要となる。

上記したように表面状態との電界効果の関係と、更なる増幅効果の向上のために、更に良好な劈開面状態が必要であり、そのためには、これらの結果を踏まえた純良な単結晶育成が不可欠となる。実際、劈開面表面にもが不可欠となる。実際、劈開面表面にものため、本研究の当初は測定系のを見たが、更なる純良単結晶育成を行うために、温度計測のより精密な測定が行うための高周波炉の改良を行った。現在、この改善したが、更なる純良の計画と電界が行っための高周波炉の改良を行った。現在、この改善したが、更なる純して行っており、この改善して行ってあり、この改善して行っため良いのは、このないである。

5.主な発表論文等なし

6.研究組織

(1)研究代表者

鈴木 博之(SUZUKI, Hiroyuki) 独立行政法人物質・材料研究機構・量子ビ ームユニット・主幹研究員 研究者番号:60354370

(2)連携研究者

矢ヶ部 太郎 (YAKABE, Taro) 独立行政法人物質・材料研究機構・表界面 構造・物性ユニット・主幹研究員 研究者番号: 80354364